**Бутусов, Игорь Юрьевич. Неразрушающий электрический контроль структур SiO2 Si в производстве МОП-транзисторов и МОП БИС : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.01 / Воронежский ун-т.- Воронеж, 1998.- 18 с.: ил. РГБ ОД, 9 98-7/1297-X**